测试技术与传感器 第8章 磁电型传感器

第7章

磁电式传感器

测试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

-、磁电式传感器基本原理

·磁电感应式传感器:又称磁电式传感器

原理:利用电磁感应效将被测量(如振动、位移、转速等) 转换成电信号的一种传感器。

·有源传感器:不需要辅助电源就能将被测对象的机械量 转换成易于测量的电信号。

• 普遍应用:输出功率大、性能稳定、具有一定的工作带宽 $(10 \sim 1000 \text{ Hz})_{a}$

测试技术与传感器

-、磁电式传感器基本原理

•磁电式传感器:将被测机械量转化为感应电动势的传感器

-电动力式传感器

•由电磁感应定律,匝数 N 的线圈在交变磁场中感生的电势 e取决于穿过线圈的磁通 Ø 的变化率,即:

 $e \square \square N \stackrel{d \square}{=}$ (3-32)

•磁通变化使线圈处于磁场中

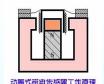
对磁场作切割磁力线相对运动 或者使磁路中的磁阻发生变化

•类型:动圈式、动磁铁式和变磁阻式等

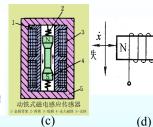
则试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

几种类型传感器的原理结构







·直线运动速度的动圈式传感器(a)

·角速度的动圈式传感器(b)

·直线速度的动磁铁式传感器(c)

·被测平面(需导磁)运动直线速度的变磁阻式传感器(d)

•重点:动圈式传感器,原理典型,工程应用广泛

测试技术与传感器

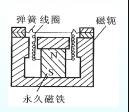
测量直线运动速度的动圈式传感器

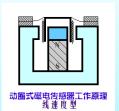
- •动圈式传感器的线圈处于永久磁铁形成的闭合 磁路工作气隙中
- •当此线圈相对于磁场作直线运动时,线圈上所 感生的电势为:



式中: N ——线圈匝数;

- B ——工作气隙中的磁感应强度;
- 1 ——线圈的单匝长度;
- v ——线圈相对于磁场的运动线速度;
- θ ——线圈运动方向相对于磁场方向的夹角。





测试技术与传感器

第8章 磁电型传感

 $e \square NBl \frac{dx}{dt} \sin \square \square NBl \square \sin \square$

此处 θ=90°, 故:

$$e = BlvN$$

- •结构参数B、I 和 N 确定, 感应电势 e 与速度 v 呈单值函数关系
- ·用输出的电势值 *ℯ* 测量线圈运动的速度——速度传感器
- •速度传感器的输出可通过积分或微分得到位移和加速度信号
- •利用该原理可制造出两种实用的速度传感器:

长行程直线速度传感器

振动速度传感器

第8章 磁电型传感器

测试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

000000000 000000000

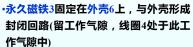
相对式振动速度传感器

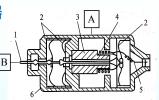
- •有两层线圈,线圈1绕在薄层绝缘材料圆筒2上,与外壳4固结
- •线圈3绕在由铁磁材料制成内轴上,
- 分两段绕制
- ·外壳4由铁磁材料制成
- •工作时对线圈1加直流电流,产生的磁通沿内轴-气隙-外壳形成封闭回路
- 内轴与外壳作相对运动时,两边气隙中的线圈切割磁力线使线圈产生感应电势;两边气隙中磁通走向相反,左右两边线圈的感应电势方向相反
- •若反向串接,两边的感应电势相加,灵敏度提高
- •输出感应电势与内轴和外壳相对运动速度成正比
- •用输出电势测量相对运动速度
- •传感器输出功率大,可用于测量机床运动工作台的直线运动速度

测试技术与传感器

测量较长直线运动速度的传感器







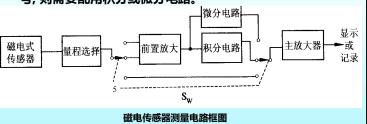
- •壳体固定在构件A上,小轴1伸出的顶杆紧固在需测相对运动的构件B上
- •小轴相对于壳体(线圈相对于工作气隙中的磁通)作相对直线振动,线圈4中产生感应电势——反映了A、B构件间的相对运动速度
- •感应电势由导线5引出
- ·顶杆需以弹性压力预紧在构件B上,以免在反向运动时因相对运动速度过大而脱开,使输出电势不能完全反映两构件间的相对运动速度
- •弹性力由曲片状弹簧2提供

测试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

磁电感应式传感器的测量电路

- 磁电式传感器直接输出感应电势,且传感器通常具有较高的 灵敏度,所以一般不需要高增益放大器。
- 磁电式传感器是速度传感器,若要获取被测位移或加速度信号,则需要配用积分或微分电路。



测试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

二、霍尔传感器

- •既不是参量型,也不是发电型传感器
- •既不是能量控制型,也不是能量转换型传感器
- •在某些领域应用广泛

测试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

二、霍尔传感器

•19世纪后期,发现在金属中存在霍尔效应

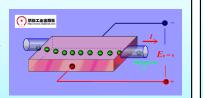
效应微弱,未被重视



•20世纪中叶, 半导体科技发展

制成实用型的元件

•20世纪60年代后,受到重视



测试技术与传感器

霍尔传感器基本原理

- •厚度为 d 的 N 型半导体薄片上垂 直作用磁感应强度为 B 的磁场
- \cdot 在一个方向上通以电流 I
- ·N 型半导体中多数载流子为电子

沿与电流的相反方向运动

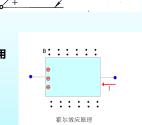
·带电粒子在磁场中的运动受洛伦兹力 F_L 的作用

 F_L 作用方向:左手定则

 F_L 作用结果: 带电粒子偏向 c , d 电极

•在垂直于 B 和 I 的方向上产生感应电动势 V_H

现象——霍尔效应, V_H ——霍尔电势



第8章 磁电型传感

第8章 磁电型传感器

(3-48)

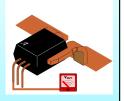
测试技术与传感器 $V_H = K_H IB \sin a$ 霍尔电势

式中: K4---霍尔常数,单位磁感应强度和 单位控制电流作用下的开路霍尔电势, 取决于材质、元件尺寸,并受温度变化影响;

- B——磁场的磁感应强度;
- I——某方向上的控制电流;
- α ——电流方向与磁场方向夹角,如两者垂直,则 $sin\alpha = 1$ 。
- •纯金属中自由电子浓度过高

霍尔效应微弱,无实用价值

- ·半导体是霍尔元件的常用材料
- ·材料的厚度 d 愈小,则 K_H 就愈大、灵敏度愈高



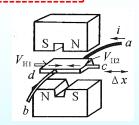
第8章 磁电型传感器

第8章 磁电型传感器

测试技术与传感器

霍尔传感器应用

•式(3-48)可知,改变 I 或 B,或两者 同时改变均会引起 V_H的变化 可以做成各种传感元件



 $V_H = K_H IB \sin a$

霍尔传感器结构

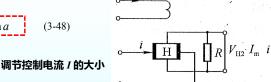
- •片芯是一块矩形半导体薄片
 - 采用 N形锗、锑化铟、砷化铟、砷化镓和磷砷化铟等
- •长边两侧面焊有两根控制电流极引线,短边两侧面的中点焊以两导线 输出霍尔电势
- ·霍尔芯片封装

采用非磁性金属、陶瓷或环氧树脂

测试技术与传感器

霍尔元件的基本电路

 $V_H = K_H IB \sin a$



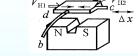
- •R 为调节电阻,调节控制电流 I 的大小
- $\cdot V_H$ 两端为霍尔电势输出端
- •在磁场和控制电流的作用下,输出端有电压输出
- · I 和 B 都可作为输入信号,输出信号正比于两者乘积
- •建立霍尔电势所需的时间极短 (10-12~10-14s)
- ·可以测量较高频率的信号

测试技术与传感器

霍尔元件位移传感器







第8章 磁电型传感器

第8章 磁电型传感

- •左半产生的霍尔电势 $V_{
 m HI}$ 和右半产生的霍尔电势 $V_{
 m H2}$ 方向相反
- $oldsymbol{\cdot}c$, d两端输出电压是 $V_{\mathrm{HI}} ext{-}V_{\mathrm{H2}}$, 若使初始位置时 $V_{\mathrm{HI}} ext{-}V_{\mathrm{H2}}$, 则输出电压为零
- •当霍尔元件相对于磁极作 x 方向位移时 ,可得到输出电压 $V_{
 m H}{=}V_{
 m H1}{-}V_{
 m H2}$,且
- $\Delta V_{
 m H}$ 数值正比于位移量 Δx , 正负方向取决于位移 Δx 的方向
- •霍尔元件传感器既能测量位移的大小,又能鉴别位移的方向

测试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

霍尔元件特点

- ・静止状态下具有感受磁场的能力
- ・结构简单、可靠性高
- ・体积小、噪声低
- · 动态范围大(输出电压变化范围可达1000:1)
- ・频率范围宽(从直流到微波频段)
- ·寿命长、价格低

测试技术与传感器

•可以广泛应用于测量:

位移

可转化为位移的力和加速度

磁场变化

•应用中不用永久磁铁产生的磁场,而是用可变电流作激磁的

可变磁场,输出电压就决定于控制电流和激磁电流的乘积

—霍尔元件就成了一种两个模拟信号乘法器

3

测试技术与传感器

第8章 磁电型传感器

第8章 磁电型传感器

霍尔元件基本特性

- 额定激励电流和最大允许激励电流
 - 霍尔元件自身温升10℃时流过的激励电流
 - 以元件最大温升为限制所对应的激励电流
- · 输入电阻和输出电阻
 - 激励电极间的电阻
 - 电压源内阻
- · 不等位电势和不等位电阻
 - 霍尔元件激励电流为 I 时, 若元件所处位置磁感应强度为零, 此时测得的空载霍尔电势。
 - 不等位电势就是激励电流经不等位电阻所产生的电压。
- 寄生直流电势
- · 霍尔电势温度系数





补偿方法

测试技术与传感器

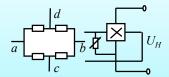
零点误差

霍尔元件误差及其补偿

电路补偿

PN节压降构成寄生直流电势, 带来输出误差。

斜)造成。③激励电极接触不良。



测试技术与传感器

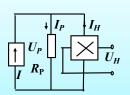
霍尔元件温度补偿

 $U_H \square K_H IB$

误差原因:温度变化时, $K_{\rm H}$, R_i (输入电阻)变化

补偿办法:

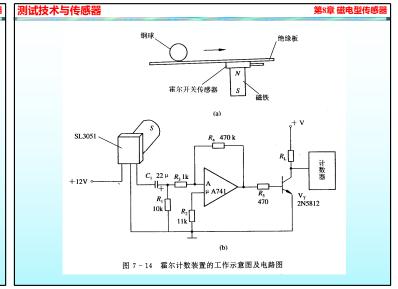
- 对温度引起的 / 补偿。采用恒流源供电。但只能减小由于输入电 阻随温度变化引起的激励电流变化的影响。
- 对 K,,I 乘积项同时补偿。采用恒流源与输入回路并联电阻。



初始状态: $K_{H0}, R_{i0}, \qquad I_{H0} \square \frac{R_p I}{R_{i0} \square R_p}$ 温度变化后: $^{k}_{Hi} \square k_{H0} [1 \square \square (t \square t_0)]$ 初始状态: K_{H0} , R_{i0} ,

 $R_{it} \square R_{i0}[1 \square \square_s(t \square t_0)]$

 $I_{Ht} \square \frac{R_p I}{R_{i0} [1 \square \square_S (t \square t_0)] \square R_p}$



不等位电势: ①电极引出时偏斜, ②半导体电阻特性 (等势面倾

寄生直流电势:由于霍耳元件是半导体,外接金属导线时,易引

起PN节效应,当电流为交流电时,整个霍耳元件形成整流效应,

测试技术与传感器

第8章 磁电型传感

The End